(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開平6-341965

(43)公開日 平成6年(1994)12月13日

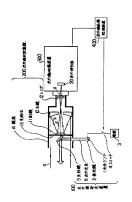
(51) Int.Cl.5	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
C 0 1 N 25/72	ĸ	6028 2 T		

		著金爾求	木蘭水 開水項の数9 UL(全 7 員)
(21)出願番号	特顧平5-133269	(71)出顧人	000004226 日本電信電話株式会社
(22) 出 城 日	平成5年(1993)6月3日		東京都千代田区内幸町一丁目1番6号
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	(72)発明者	桑野 博喜
			東京都千代田区内幸町一丁目1番6号 日
			本電信電話株式会社内
		(72)発明者	藤原 幸一 東京都千代田区内幸町一丁目1番6号 日
			東京都干1、田区内学引一 J 日 1 毎 0 号 日本電信電話株式会社内
		(74)代理人	弁理士 鈴江 武彦

(54) 【発明の名称】 輸装購劣化検査方法及び検査装置 (57) 【要約】

【目的】本発明は、天候、時間に左右されず、遠隔的に 塗装膜の劣化を判定する塗装膜劣化検査方法及び検査装 僧を提供することを目的とする。

【構成】本発明は、赤外線を被検査塗装膜に投光する赤 外線投光装置100と、前記被検査塗装膜を捕捉する赤 外線用望遠鏡200と、前記被検査塗装膜の温度分布を 測定する赤外線映像装置300と、前記被検査塗装膜の 温度分布から劣化部を判定する赤外線画像処理装置40 0とを具備して構成する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 被検査管装膜を遠隔的に熱励起する熱励 起工程と、該核検査管装膜の温度分布を非無機調定する 非接触測定工程と、前記熱励起工程によって誘起される 温度分布から劣化部を判定する劣化部判定工程とからな ることを特徴とする企業解奏化検査方法。

【請求項2】 前記熱励起工程が、集光された赤外線ビームを一時的に照射することによってなされることを特徴とする請求項1記載の塗装膜劣化検査方法。

【請求項3】 前記非接触測定工程が、被長3μmから 6μm帯あるいは波長8μmから14μm帯の赤外線を 検知する赤外線映像装置によってなされることを特徴と する請求項1距載の発装膜等化検査方法。

【請求項4】 前記劣化解制定工程が、定められた視野 中の同一赤外線画像における最高温度と最低温度を測定 し、その速度差が予め定められた温度、あるは該温度 差が最大になる時点の温度分布画像を対象としてなされ ることを特徴とする請求項1配載の登装膜劣化検査方 法。

【請水項5】 赤外線を被除左敵装販に投光する赤外線 投光装置と、前記被検査施装販を摘捉する赤外線料用望遠 級と、前記接検査施装販の進度分布を測定する赤外線映 像装置と、前記接検査施装販の進度分布から分化部を判 定する赤外線調像処理装置とを具備することを特像とす る施装販序に検査装置。

【請求項6】 前記赤外線投光装置が、前記赤外線用望 遠鏡に組み込まれ、同軸照明であることを特徴とする請 求項5記載の塗装膜劣化検査装置。

【請求項7】 前記赤外線用望遠鏡が、被検査塗装膜補 提用の低倍率望遠鏡を具備した反射型望遠鏡であること を特徴とする請求項5記載の塗装膜劣化検査装置。

【請求項8】 前記添外轉論做处理装置が、赤外轉映後 装置からの映像出力を切り出十刻定視野限定回路と、該 測定視野中の最高温度と軽低温度を検出十る検担回路を 有し、該最高温度と該幾低速度の温度差を預算する演算 回路と、下め登録された温度と前記温度差をを放する演算 比較回路と、該比較回路の出力に基づき赤半瞬間後をフ リーズする回路と、該回路のフリーズ時点を外部に通知 するトリプー出力回路とと見帰することを特徴とする論 求項目の認めを转換が化能を接觸。

【請求項9】 前記赤外線画像処理装置からのトリガー 出力によって赤外線発光装置が投光停止する機能を具備 することを特徴とする請求項8記載の塗装膜劣化検査装 ※

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、橋梁、タンク、アンテナ鉄塔等の屋外構造物や建築物の塗装劣化を診断する塗 装膜劣化検査方法及び検査装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】屋外に暴露される強装験は準外線、熟 雨水等によって劣化し、放置しておくと海地の発端に至 る。屋外構造物の美観、資産価値を維持するためには、 金装額の多化診断が重要であり、発輔前に強替える必要 がある。整督え時期、整督を範囲の判断は、保守経費の 経済化を図る上で重要である。

【0003】 塗装機の劣化診断法としては、従来から種々の方法が提案され、実用されてきた。例えば、劣化度 厚本を併用した目視による主観的検査の他に、 塗装機の厚みを電気化学的に測定する方法、あるいは塗装機の付着性を調べるクロスカットテスト等の客観的検査法がある。しかしながら、これらの検査法は、被検査対象物の近くで、あるいは、上記の客観検査法の場合、液検査対象物に接触して検査しなければならないため、大型の屋外構造物の塗装機が化き値隔診断することが出来なかっ

【0004】一方、本売明に関わる。赤外線映像装度に よる建築物の外壁タイルの剥削部所方法は、遠隔が良格によって 断する方弦であり、その原理は、太陽の放射係にかって 退められたタイルの剥離部と韓全部におけるタイル表面 の退度差を測定することによって、剥離部を検出する方 芯である。すなわち、健全部ではタイル表面の線はスム 一ズにコンクリートに伝達されるが、剥削能ではその界 面に熱の不良導体である空気層が介在しているため、勢 が逃げにくくなり、健全部に軟ペタイル表面湿度が高く なる現象を利用している。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】従来の赤外線診断法は 太陽を熱課とする受勤的後度近であるため、天候、時 別、場所に左右される欠点からた。また、米売別者ら の研究によれば、太陽を熱源とする方法の場合、 盤装帳 は厚さが薄いため、自然状態では、釜装接表面と素地の 温度差がほとんど生じないことが分かった。そのため、 往来の赤外線診断法は釜装模の劣化診断には適用できな かった。

【006】さらに、従来の赤外線診断法はタイルやキルタル等の大きな対象物の剥離の有無を診断すれば良かったが、本原が対象とする乾酸の場合、 登装膜の劣 化初期においては、検知すべき膨れ、はがれ、クラックは登装膜の狭い範囲で発生しているので、遠隔的に診断するためには、赤外線映像装置の位置分解能が必要である。

[0007] 本発明は上記の事情に鑑みてなされたもの で、天候、時間に左右されず、遠隔的に塗装膜の劣化を 判定する塗装膜劣化検査方法及び検査装置を提供するこ とを目的とする。

[0008]

【課題を解決するための手段】 上記目的を達成するため に本発明の验装膜劣化検査方法は、核検査塗装膜を連構 的に熱励起する熱励起工程と、該被検査塗装膜の進度分 布を非接触測定する非接触測定工程と、前記熱励起工程 によって誘起される温度分布から劣化部を判定する劣化 部判定工程とからなることを特徴とするものである。

【0009】又、前記熱励起工程が、集光された赤外線 ビームを一時的に照射することによってなされることを 特徴とするものである。

【0010】 又、前記非接触測定工程が、波長3 μ mから6 μ m帯あるいは波長8 μ mから1 4μ m幣の赤外線 を検知する赤外線映集機によってなされることを特徴 とするものである。

【0011】 又、前記劣化部判定工程が、定められた視 野中の同一赤外線画像における最高温度と最低温度を測 定し、その温度差が予め定められた温度、あるいは該温 度差が最大になる時点の温度分布画像を対象としてなさ れることを特徴とするものである。

[0012] 又、本発明の微弦概劣化検査装置は、赤外線を被検査整装膜に投光する赤外線投光装置と、前記被検査監禁膜を排提する赤外線円型強後と、前記被検査監装膜の温度分布を測定する赤外線映像装置と、前記被検査監禁機の温度分布から5/に配を判定する赤外線画像処理装置とを慢性することを特定とするものであ

【0013】又、前配赤外線投光装置が、前配赤外線用 望遠鏡に組み込まれ、同軸照明であることを特徴とする ものである。

【0014】又、前記赤外線用望遠鏡が、被検査塗装模 捕捉用の低倍率望遠鏡を具備した反射型望遠鏡であることを特徴とするものである。

【0015】又、前記赤外線開像処理装置が、赤外線映像装置からの映像出力を切り出十測定視野保定回路と、該測定視野中の最高温度と整低温度を検出する検出回路を有り、該最高温度と該最低温度の温度差を消算する演算回路と、予め登録された温度と前記道度差とを比較中間と、該比較回路のし力に基づき赤海副像をフリーズする回路と、該回路のフリーズ時点を外部に通知するトリカー出力回路とを具備することを特徴とするものである。

【0016】又、前記赤外線画像処理装置からのトリガー出力によって前記赤外線投光装置が投光停止する機能 を具備することを特徴とするものである。 【0017】

【作用】本原明の強装販売化除差法は、従来の赤外線診 断動的に懸励起することが一つの特徴である。本発明者ら は、赤外線映像装置を劣化した接検査強装膜に向け、強 装膜の劣化診断を試みたが、均一な両線しか得られず、 次化判定は不可能であった。その理由は、数接側のよう に膜厚が例えば1mm以下の薄い被検査対象体では、通 常太陽線で定常的に温められているから、強装膜の すた地面の速度はほぼ同じであり、発装膜が再載していて 下地面の速度はほぼ同じであり、発装膜が再載していて

も温度差がつかないためである。

【0018】本発明は、塗装模表面を短時間加熱し、温度上昇の過渡特性を利用することにより、劣化した塗装 腹と蜂全な塗装膜を強別するため、天候、時間に左右さ れず、連隔の監装膜の劣化を判定することができる。 【0019】

【実施例】図3、図4 は本条明の詮装膜劣化除金法の原理を模式的に説明する図であって、図3は登装したモデル部材の断値図であり、1000は詮装下地。2000は詮装原域。3000はモデル部材加熱用の赤外ランプである。そして、Aは鍵全盤装膜部、Bは離れが生じた劣化登装膜地を示す。多化验室膜部沿は金装膜 2000と登装下地1000万向への際伝導率は健全盤装膜部系よりも劣っている。なお、通常、屋外構造物は刺微数であるから、整装膜2000よりも労まで地1000万が熱伝導率は

【0020】図4は錬全塗装膜部A、劣化塗装膜部Bの 温度変化の時間依存性であって、図4(a)は赤外ラン ブ消灯時、図4(b)は赤外ランプ点灯直後、図4

(c) は赤外ランブ加熱後に消灯した場合である。な お、健金能装販部A、5代能装販部の温度は、市販の 赤外線快乗貨費を用いれば水域能で求めることが出来 る。図4 (a) の赤外ランブ消灯時の場合は、健全能装 映部A、劣化能装販部Bともに同温度であり、時間依存 性はない。図4 (b) の赤外ランブ点灯電後の場合は、 劣化能装販部Bの温度上非が機全能装販部A、よりも早い 、長時間赤ゲランブで加熱すると機金能設部A、劣 化金装販部B共に同温度になる。そして、この状態で赤 外ランブを切った図4 (c) の場合は、健全整装販部A の温度の方が多化金装販部B、りも早く低下する。

【0021】このようにして、塗装膜2000表面を増 時間加熱されば、煙全塗装膜部Aと劣化塗装膜部Bの温 度差を入工的に過渡的につくり出すことが出来る。劣化 初期の塗装膜を鋭敏に検出するためには、温度差が最も 大きくなる条件、例えば、図4(b)の場合は矢印で示 した時間線に測定することが認ましい。

【0022】 整装膜2000表面の温度分布制定は、非接触制定をする必要があるので、検出接及が3μmから 6μm帯の1nSb赤外線接出器、あるいは、赤外線因 体漿像素子、8μmから14μm帯のHgCdTe赤外 線検出器が内臓された赤外線映像装置を用いて行なうこ とが望ましい。

【0023】本発明の他の特徴は、錬全盤装販筋と劣化 参装販部の温度差が最大になる最適条件で披検変販が自 動検査される点にある。すなわち、上述した。能動的熱 助起と温度差分布の測定が想動して行なわれるようにな っているから、温度差が最大さくなる条件で温度分布 画像がフリーズ・最調され、赤外ランプは自動消灯され る。そして、このフリーズ画像を対象として、オンライ いあないはオウラインで商庫では存在するを使き装販部 の位置、而積等が算出される。このような特徴があるか ら、検査者は本発明の管鉄膜検査装置を被検査膜に向 け、測定開始ボタンを押すだけで検査結果が自動的に表 示される。

【0024】前連の最適条件を自動的に見つける方法としては、例えば次のような方法を取ることができる。すなわら、登集原系化検査装御の関定関始が2を押すと、被検査機の熱励起がスタートし、赤外線映像装置の削定開加まりを必由したで測定し、その個度差の制度を対しませた。そして、その個度差が最高あるいは予め定められた温度に達した時点の温度分布画像をフリーズするとともに、熱助と存止するともに、然動を停止する。最高温度は、劣化塗装膜中で素地との熱伝導をが最も悪い部分において発生し、最低温度は健全塗装等が最も悪い部分において発生し、最低温度は健全塗装等が最も悪い部分において発生し、最低温度は健全塗装等が最も悪い部分において発生し、最低温度は健全塗装等等分といて見られるからである。

【〇〇2 5】次に、本発明の他の特徴を説明する。本発明の金装販労化検査方法によれば、赤外線検像装置は解 理教術の影外機の大力では原地の改造を登装販 を、数ミリ程度の分解的形成をのための赤外線を同軸域は できるようになっているから、熱助起解域と測定網域は 自動的にアライメントされている。望遠鏡としては、5 O m適力の管装販を検査するには、例えば、提野角2 方度以下の相望遺鏡を使用することが望ましい。

【0026】以下に図面を参照して本発明をより具体的 に認述するが、以下に示すものは本発明の一実施例にす ぎず、本発明の技術的範囲を何等制限するものではな

【0027】図1は本影明の第1の実施例を示す管装験 劣化検査装置の観路説明図であって、赤外線投光装置1 00、赤外線用望遠鏡200、赤外線投後実置300、 赤外線画像処理装置400から構成されている。赤外線 投光装置100は、赤外ランプ1、集光鏡2、電廊3、 ペイッチ4、反射鏡5から成っている。赤外線 200は、主鏡10、耐鏡11、レンズ12、支持体1 3、鏡前14から成っている。赤外線快像装置300は 列えば市販の赤外線映像装置(三菱サーマルイメージャー、三菱視機製、1RーM300)等であり、赤外検出 器200地に、図には示していないが該赤外検出器20 の冷却用のスターリングサイクルクーラが内値されている。

【0028】次に、赤外線更光装置100の構成部品、 装置類の機能並びに動作を空即する。赤外ランプ1はタ ングステンフィラメントを光源とするものであって、放 射された赤外線、並びに可視光線は放物面型の単光平 によって、平行ビームに形成され、赤外光平 毎 5 地 つ 赤外線用望塗鏡 2000鏡筒 14の側面に入射される。 入射された赤外光度6は、支持体13に取り付けられた 反射鏡方によって赤外線用望遠鏡 200と開始で接検査 途装膜に投光される。スイッチ4は、後述する赤外線画 像処理装置400からのトリガーによって、自動的に消 灯されるようになっている。

【0029】赤外線用型速線200は、焦点配離200 mmのカセグレン式の反射型遠線であって、主線10 m線11、レンズ12と、崩線11並びに交射機5を固定支持するための支持体13、及びこれらの光学部品を収容する線筒14から構成されている。赤外線用型速度20に入ら入射光線。は上線10によって反射され、光線5となって耐錠11に入射し、反射光線cはシリコン製レンズ12で屈折され、屈折光はは赤外検出器20に入る。

【0030】なお、図1には示していないが、前記赤外 線用望遠鏡200には、速力の接検査強装要を捕捉する ための倍率2倍の低倍率望流鏡が取り付けられている。 該低倍率望鏡は、視野中に十字線が入っているから、 検査対象を十字線に合わせるように、赤外線突微装置3 00の向きを調節すればよい。このような低倍率望速 を併用した理由は、本実施側の焦点距離200mmの望 遠鏡のみの場合、視野角は1.8×1.4度であり、ご く狭い視野のみを大きく拡大することになるから、検査 対象の機を対策に国軽になるためである。

【0031】次に、赤外線画像処理装置400の機能を 説明する。図2は本発明の中核を担う赤外線画像処理数 置400の回路プロック図であって、測定視野駅定回路 30と、該数定視野中の最高進度を検出する最高温度検 出回路31と、同最低温度検出回路32と、該最高温度 と該最低温度の温度差を複算する温度差深算回路33 、最高調度差を影験する最高温度差メモリ回路34

と、登録温度差メモリ35と、切換器36と、温度差比 較回路37、赤外線面像フリーズ回路38と、劣化面積 表示回路39と、トリガ出力回路40とから構成 されている。

【0032】 割定視野規定回路30は、赤外線映像装置300からの映像出力を切り出すための回路である。面 優切り出しば、カーソルキーによって、上下左右、任意の面積を切り出せるようになっている。本処明の検査方を検査する場合、未外線順等中の背景画像を除去する必要がある。なぜならば、後述の、最低温度独画阻路32は 健全能集険間の温度を検出するためのものであるが、育量関係が含まれている場合、最低温度は過常与異菌像をでした。

【0033】最高温度検出回路31、最低温度検出回路 32は前記測定視野限定回路30の映像出力に対してな され、1画像フレーム中の最高温度と最低温度がほぼリ アルタイムで検出される。

【0034】温度差演算回路33は前記最高温度と最低

温度の検算回路である。そして、その温度差は最高温度 差メモリ回路34によって、前記温度差検算回路33か ら刻々送られて来る温度差の時系列中で最高温度のみが 更新ዋ級される。

【0035] 登録復度差メモリ35は、平動で設定した 重度を整数するものである。切機器36は前記最高温度 差と登録直度差のいずれかを切り換えるものである。 【0036] さて、前記返度差淡薄回路33と切機器3 の出力は、塩度差比較回路37にふって実施温度差と 登録温度差2時を103。切機器36が登録温度差と 受別温度差と整線温度差が比較される。切機器36が登録温度差と 以35に終続されている場合、温度差比較回路37で実 が温度差と整線直度差が比較の路37で表 が、劣化価積液算・表示回路39によって検査結果が表 示される。また、この場合、トリガ出力回路40によっ て、赤外機差光炭優100のスイッチ4が作動し、赤外 機段光が停止される。

【0037】前記別幾器36が最高組度差×モリ回路3 4に接続されている場合、実測温度差と最高登峰温度差 が比較され、もし、実測温度が低くなった時点で、画像 フリーズ回路38によって画像がフィックスされ、劣化 高積度算・表示回路39によって検査結果が表示され る。また、この場合も同様に、トリガ出力回路40によって、赤外線投光装置100のスイッチ4が作動し、赤 外線投光が戻止される。

[0038]

【発明の効果】以上説明したように、本発明の途装験劣

化検査方法及び検査装置によれば、被検査登装膜を熱励 起する手段を具備しているから、天候、日時、場所によ らず、塗装膜劣化検査を実施することが出来る。また、 赤外線用望遠鏡を具備しているから、微細な塗装膜の膨 れやはがれ等を薄隔的に検索することができる。

【0039】本発明は、このような特徴があるので、従来不可能であった、橋梁、タンク、アンテナ鉄塔等の屋 外構造物や強物の途装劣化を、天候、日時、場所に左右 されず、遠隔的に診断することが可能である。

【図面の簡単な説明】 【図1】本発明の一実施例を示す塗装膜劣化検査装置の

概略構成説明図である。 【図2】図1の赤外線画像処理装置の一例を示す回路ブロック間でする。

ロック図である。 【図3】本発明の塗装膜劣化検査法の原理を説明する塗

装部の断面図である。 【図4】本発明の塗装膜劣化検査法の原理を説明する特 体図である。

【符号の説明】

1 …赤外ランプ、2 …集光鏡、3 …電源、4 …スイッ チ、5 …反射鏡、6 …赤外光泉、10 …主鏡、11 …副 鏡、12 …レンズ、13 …支持体、14 …鏡。20 … 赤外検出器、100 …赤外線投光装置、200 …赤外線 用望遠鏡、300 …赤外線を接置、400 …赤外線 像処理装庫、100 … 監禁下地、2000 … 盤装膜、 3000 …素外ランプ。





